

Анализ дефектной структуры полупроводниковых материалов

Kukk, Peeter-Enn Применение металлоорганических соединений для получения неорганических покрытий и материалов : тезисы докладов V всесоюзного совещания, Горький, 8-10 сентября 1987 г. 1987 / с. [?] https://www.ester.ee/record=b2351386*est

Фотолюминесценция как метод оценки качества химически пульверизованных пленок

Erm, Ants; Krunks, Malle; Mellikov, Enn Применение металлоорганических соединений для получения неорганических покрытий и материалов : тезисы докладов V всесоюзного совещания, Горький, 8-10 сентября 1987 г. 1987 / с. 191-192 https://www.ester.ee/record=b2351386*est